

# 装置利用料金一覧

R03.07-

## 通常利用

| 装置名                                  | 装置名(略称)         | 型番               | 学内利用料金                  |
|--------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|
| 蒸着装置                                 | CC              | JEE-400          | 無料                      |
| 走査型電子顕微鏡                             | SEM-EDS         | JSM-IT200        | 800円/時間                 |
| 電界放出形走査型電子顕微鏡                        | FE-SEM-EDS/EBSD | JSM-7100F        | 1,200円/時間               |
| 電子プローブマイクロアナライザー                     | EPMA            | JXA-8800         | 1,000円/時間               |
| 電子プローブマイクロアナライザー(OMT)                | EPMA-OMT        | JXA-8800         | 1,400円/時間               |
| 電界放出形電子プローブマイクロアナライザー                | FE-EPMA         | JXA-8530F        | 2,000円/時間               |
| 波長分散型蛍光X線分析装置                        | XRF             | MagiX PRO        | 1,700円/時間               |
| 卓上X線回折装置                             | XRD             | MiniFlex600      | 300円/時間                 |
| 表面電離型質量分析計 <sup>1</sup>              | TIMS            | MAT262           | 1,500円/日                |
| マルチコレクター型誘導結合プラズマ質量分析装置 <sup>2</sup> | MC-ICP-MS       | NEPTUNE plus     | 3,000円/試料               |
| 誘導結合プラズマ質量分析装置 <sup>2</sup>          | ICP-MS          | X-series         | 2,000円/試料               |
| 初回講習料 <sup>3</sup>                   | 全装置             | X線関連装置<br>質量分析装置 | 上記料金の3時間分<br>1試料分または1日分 |

- 1: 表面電離型質量分析計は、消耗品類を全て各自で準備していただきます。
- 2: 溶液化した試料の場合の料金です。それ以外の場合は委託分析となります。
- 3: 利用者の経験に応じて、上記以外に別途講習会を設定させていただく場合があります(別途料金)。

## 委託分析: 微小領域表面分析

| 項目                     | 装置名(略称)         | 型番        | 委託料金       |
|------------------------|-----------------|-----------|------------|
| 前処理(炭素蒸着) <sup>1</sup> | CC              | JEE-400   | 1,200円/1回  |
| 半定量分析(SEM-EDS)         | SEM-EDS         | JSM-IT200 | 2,000円/1試料 |
|                        | FE-SEM-EDS/EBSD | JSM-7100F | 2,500円/1試料 |
| 面分析(EDS)<br>(EDS/EBSD) | SEM-EDS         | JSM-IT200 | 1,200円/時間  |
|                        | FE-SEM-EDS/EBSD | JSM-7100F | 1,800円/時間  |
| 定量分析 <sup>2</sup>      | EPMA-OMT        | JXA-8800  | 4,200円/時間  |

- 1: 導電性のない試料は炭素蒸着の前処理が必要です。場合によっては表面研磨が必要となることがあります(別途料)
- 2: 定量分析で標準試料持ち込みの場合、標準試料の前処理料金が別途加算されることがあります。

## 委託分析: バルク分析

| 項目  | 装置名(略称)   | 型番           | 委託料金        |
|---|-----------|--------------|-------------|
| 粉末試料作成  |           |              | 5,000円/1試料  |
| ガラスビード作成自作 <sup>1</sup>                               |           |              | 500円/1試料    |
| ガラスビード作成 + 主成分元素分析 <sup>2</sup>                       | XRF       | MagiX PRO    | 6,000円/1試料  |
| ガラスビード作成 + 微量元素分析 <sup>3</sup>                        |           |              | 8,500円/1試料  |
| ガラスビード作成 + 主成分元素分析 <sup>2</sup> + 微量元素分析 <sup>3</sup> |           |              | 9,000円/1試料  |
| 微量元素・希土類元素分析 <sup>4</sup>                             | ICP-MS    | X-series     | 10,000円/1試料 |
| 同位体比分析 Sr   | MC-ICP-MS | NEPTUNE plus | 20,000円/1試料 |
| 同位体比分析 Nd   |           |              | 30,000円/1試料 |
| 同位体比分析 Pb   |           |              | 10,000円/1試料 |

- 1: 別途装置使用料(通常利用分)がかかります。
- 2: Si, Ti, Al, Fe, Mn, Mg, Ca, Na, K, P (酸化物)
- 3: Sc, V, Cr, Co, Ni, Cu, Rb, Zn, Sr, Y, Zr, Nb, Ba, Pb, Th, Ga, La, Ce
- 4: Li, Sc, V, Co, Zn, Ga, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Cs, Ba, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Hf, Ta, W, Pb, Th, U

※蛍光X線分析(XRF)で上記以外の元素分析をご希望される場合は、別途料金がかかります(要相談)。

※バルク分析の前処理作業は、協力講座の実験スペースを借用することになりますので、日程等は前もってご相談願います。

地球惑星固体物質解析システム研究室

運営責任者 栗谷 豪  
技術専門職員 松本 亜希子